

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ ПОТОКА ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ КОСМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ

В. Т. Коган, Б. В. Кошевенко, А. К. Павлов, А. В. Карпов

Введение

Изучение плазменных потоков в космическом пространстве связано с необходимостью проведения автономного анализа составляющих их частиц в широком динамическом диапазоне. Требования к динамическому диапазону могут быть обусловлены разными причинами: во-первых, существенным изменением интенсивности исследуемых потоков во времени,

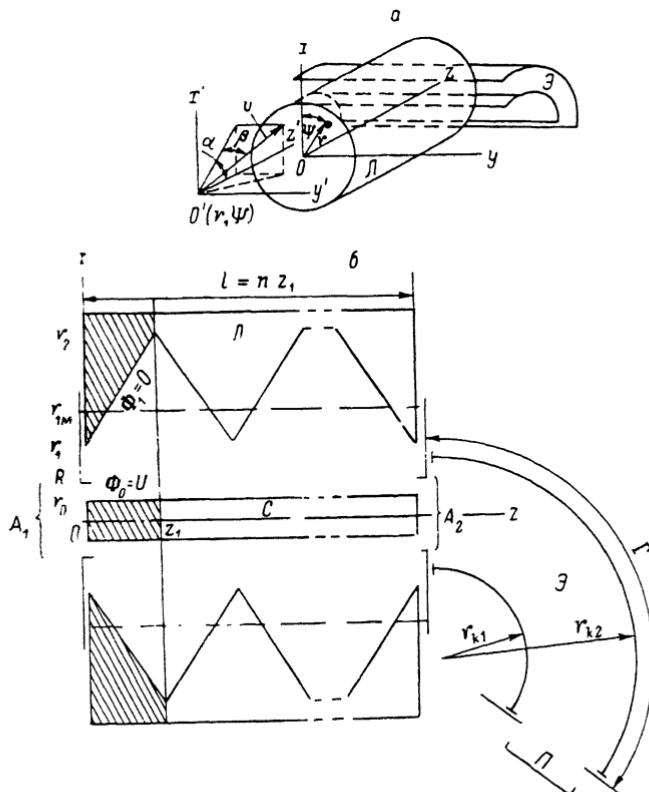


Рис. 1. Ионно-оптическая схема электростатического фильтра и энергоанализатора.
а — изометрия, б — проекция на плоскость xz .

в пространстве координат или в пространстве скоростей, во-вторых, необходимостью изучать спектры элементов низкой и высокой распространенности одновременно [1–3].

Ограничительность динамического диапазона анализаторов связано с возможностями датчиков, применяемых для этой цели. Они не обеспечивают линейной зависимости сигнала на выходе анализатора от величины потока на его входе, в необходимом интервале значений интенсивностей исследуемого потока.

Электростатический фильтр для ослабления потока ионов

Один из способов расширения динамического диапазона — применение фильтра, ослабляющего поток заряженных частиц до попадания его в анализатор. Ослабление достигается воздействием электростатического поля на частицы в выбранном интервале энергий. Этот способ становится эффективным, если для рассеивающего потенциала U , подаваемого в фильтр, и энергии частиц E выполняется соотношение $U \ll E/Q$, где Q — заряд иона.

На рис. 1 представлена схема фильтра, предназначенного для проведения исследования потоков космической плазмы в автономном режиме. Возможности предложенной схемы реализуются лишь при совместном ее использовании с энергоанализатором, например электростатическим цилиндрическим конденсатором \varTheta (рис. 1). Величина потенциала на стержне C фильтра выбирается в зависимости от энергии частиц, на пропускание которых настроен энергоанализатор, и от требуемого ослабления потока. Профиль фильтра L выбран такой формы, чтобы исключить попадание частиц, рассеянных на его стенках, в выходное окно A_2 . Электрическое поле фильтра определялось в предположении большого количества повторяющихся звеньев $n \geq 10$. В этом случае в пределах одного звена уравнение Лапласа для потенциала можно свести к эллиптическому уравнению с соответствующими граничными условиями и произвести расчет поля численным методом.

Уравнение Лапласа в цилиндрической системе координат с учетом симметрии потенциала — относительно координаты Ψ сводится к уравнению

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \Phi}{\partial \rho} \right) + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial Z^2} = 0, \quad (1)$$

где $\rho = r/r_1$, $Z = z/r_1$.

Границные условия (рис. 2)

$$\Phi(\rho = \rho_0) = \Phi_0 (= U), \quad \Phi(\rho = \rho_1 + Z \cdot K) = \Phi_1 (= 0),$$

Рис. 2. Распределение потенциала

a — внутри звена, b — на границах звена $Z=0$ (1), $Z=z_1$ (2) и в цилиндрическом конденсаторе с радиусами обкладок ρ_0 и ρ_2 (3).

$$\frac{\partial \Phi}{\partial Z} \Big|_{Z=0} = 0, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial Z} \Big|_{Z=z_1} = 0, \quad (2)$$

где $\rho_0 = r_0/r_1$, $z_1 = z_1/z_1$, $\rho_1 = 1$, $\rho_2 = r_2/r_1$, $k = (\rho_2 - \rho_1)(1/z_1)$.

Решение уравнения (1) с граничными условиями (2) в области $\rho \in [\rho_0, \rho_1 + Z \cdot K]$, $Z \in [0, Z_1]$ было получено численным методом. Результаты расчета потенциала внутри каждого звена и на его границах представлены на рис. 2. Здесь же представлено поле фильтра с параметрами, соответствующими сечению $z = z_1$, и цилиндрическим профилем. Видно, что характер поля около стержня близок к цилиндрическому. В дальнейшем при расчете функции пропускания с целью упрощения использовалась модель поля электростатического цилиндрического конденсатора. Сопоставление карты поля цилиндрического и реального фильтров позволило определить условия корректной замены одной модели поля другой, т. е. определить ограничение на размер окон A_1 и A_2 : $R = r_1/2$, а также найти параметры модельного цилиндрического конденсатора

$$\rho_{0M} = \rho_0, \quad \rho_{1M} = \rho_1 \left(\frac{\rho_1}{Z_1 + \rho_1} \right) + \rho_2 \left(\frac{Z_1}{Z_1 + \rho_1} \right), \quad \text{для } 1 \leq \frac{\rho_1}{Z_1} \leq 5.$$

Свойства фильтра

Траектории частиц в поле реального фильтра определялись лишь в отдельных контрольных точках и сопоставлялись с траекториями в поле модельного цилиндрического конденсатора.

В поле реального фильтра траектории частиц определялись путем численного интегрирования уравнений движения последовательно в каждом из его звеньев с учетом их ориентации и скачка потенциала на границах A_1 и A_2 .

Траектории движения частиц в поле модельного цилиндрического фильтра определялись путем интегрирования уравнений

$$M\dot{r} - M_r \dot{\Psi}^2 = - \frac{\partial \Phi}{\partial r} Q,$$

$$M\dot{\Psi}^2 \Psi = 0,$$

$$M\ddot{Z} = - \frac{\partial \Phi}{\partial Z} Q$$

с учетом скачка потенциала на входной и выходной границах фильтра.

Из результатов расчета траекторий движения частиц в реальном и цилиндрическом фильтрах следует хорошее согласие между их аппаратурными функциями. По данным чис-

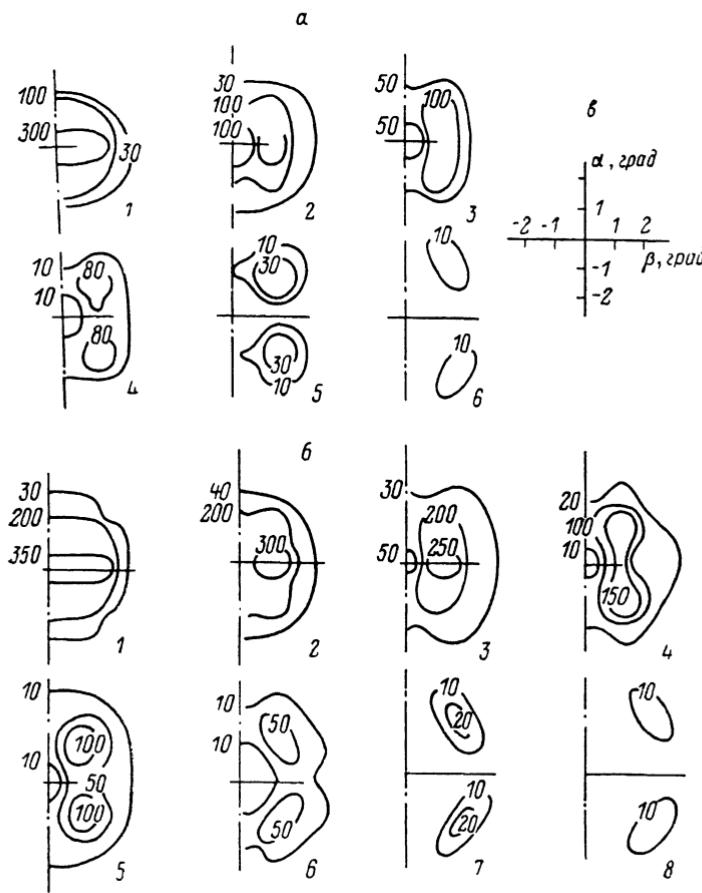


Рис. 3. Угловая функция пропускания фильтра с параметрами $r_1=2$ мм, $r_0=0.5$ мм, $z_1=2$ мм, $R=1$ мм совместно с энергоанализатором $r_{k1}=38$ мм, $r_{k2}=42$ мм, $\Gamma=127^\circ$. Линии равной интенсивности функции пропускания при различных значениях $(QU)/E$.

$1 - 10^{-8}$, $2 - 2 \cdot 10^{-3}$, $3 - 3 \cdot 10^{-3}$, $4 - 4 \cdot 10^{-3}$, $5 - 5 \cdot 10^{-3}$, $6 - 6 \cdot 10^{-3}$, $7 - 7 \cdot 10^{-3}$, $8 - 8 \cdot 10^{-3}$; фильтры длиной 30 (a) и 35 мм (b). Координаты и масштаб графиков ϵ .

ленного моделирования отличие величин пропускания фильтров не превышает 5 %. Таким образом, замена реального фильтра с пилообразным профилем на цилиндрический с учетом указанных выше ограничений обоснована.

Моделирование работы фильтра

В результате численного моделирования работы фильтров совместно с электростатическим цилиндрическим конденсатором (рис. 1) получены зависимости пропускания фильтров различной длины $l=30, 35$ мм от потенциала на рассеивающем стержне U . Эти зависимости представлены на рис. 3, a, b.

Экспериментальное моделирование осуществлялось следующим образом. На входное окно фильтра, собранного совместно с энергоанализатором в соответствии со схемой, представленной на рис. 1, подавался пучок ионов, засвечивающий часть площади окна (рис. 4, а). Разброс ионов в пучке по углу α составлял до $\pm 2.5^\circ$, а по β — менее $\pm 0.5^\circ$. Сопоставление экспериментальных и расчетных данных для $l=35$ мм представлено на рис. 4, б.

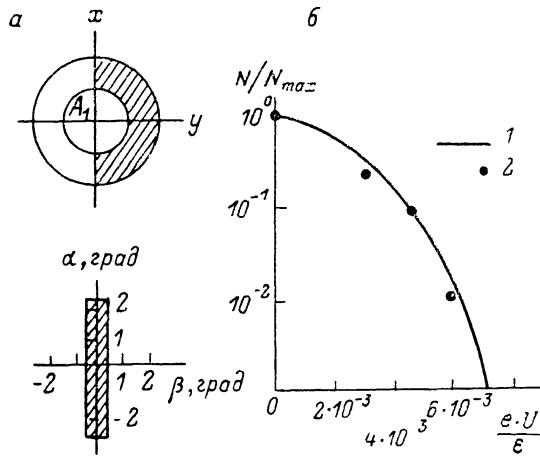


Рис. 4. Зависимость коэффициента ослабления фильтра длиной 35 мм и энергоанализатора от рассеивающего потенциала U .

а — области засветки входного окна по поверхности и углу. б — коэффициент ослабления потока ионов в зависимости от рассеивающего потенциала; 1 — расчет, 2 — эксперимент.

Заключение

Результаты расчета и моделирования показывают, что предложенный фильтр совместно с энергоанализатором позволяет обеспечить ослабление исходного потока заряженных частиц в 0—100 раз и более. Особенно важно, что это достигается приложением малых потенциалов к элементам фильтра $U \ll E/Q$.

Список литературы

- [1] Marsch E., Mühlhäuser K.-H. // J. Geophys. Res. 1982. Vol. 87. N A1. P. 52—72.
- [2] Marsch E., Mühlhäuser K.-H. // J. Geophys. Res. 1982. N A1. P. 35—51.
- [3] Marsch E., Goldstein H. // J. Geophys. Res. 1983. Vol. 88. P. 9933—9940.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Поступило в Редакцию
3 апреля 1989 г.

10; 12

Журнал технической физики, т. 60, в. 4, 1990

© 1990 г.

ИОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОРОИДАЛЬНОГО ЭНЕРГОАНАЛИЗАТОРА СО СЛАБОДЕФОРМИРОВАННЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ

М. И. Явор

При конструировании энергоанализаторов секторного типа, использующихся в статических масс-спектрометрах, большое значение имеет определение допусков на их изготовление и сборку. Поэтому представляет интерес установление аналитической зависимости вариации фокусирующих и дисперсионных свойств анализаторов от типа и величины деформации электродов. Для цилиндрического конденсатора такая задача решалась в работах [1, 2]. Для тороидального дефлектора, который находит все более широкое применение в высокоточноточных масс-спектрометрах, теория допусков развита лишь для дефектов, сохраняю-